

DIN EN ISO 18452:2016-09 (D)

Hochleistungskeramik - Bestimmung der Dicke keramischer Schichten mit einem Kontaktprofilometer (ISO 18452:2005); Deutsche Fassung EN ISO 18452:2016

| Inhalt | Seite |
|--|--------------|
| Europäisches Vorwort..... | 3 |
| Vorwort..... | 4 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Kurzbeschreibung..... | 5 |
| 5 Prüfumgebung..... | 5 |
| 6 Prüfeinrichtung..... | 6 |
| 6.1 Kontaktprofilometer | 6 |
| 6.2 Kontaktastkopf..... | 6 |
| 7 Proben..... | 7 |
| 7.1 Allgemeines | 7 |
| 7.2 Oberflächenbedingungen | 7 |
| 7.3 Anzahl der Proben | 8 |
| 8 Durchführung | 8 |
| 9 Berechnung | 9 |
| 10 Grenzen für die Stufenhöhe | 10 |
| 11 Prüfbericht | 10 |
| Anhang A (informativ) Einfluss des Verstärkungsfaktors und der Nivellierungsabweichung auf die gemessene Schichtdicke..... | 11 |